

Mesures précises de la pollution particulaire



CLEMEX PSFILTER

Mesures précises de particules aussi petites que 0,5 micron

Prêt à analyser une fois installé

Installation personnalisée, calibration automatisée et service après-vente: vous pouvez aussitôt commencer vos analyses avec nos systèmes clés-en-main Clemex PSFilter.

Niveaux de propreté particulaire

Mesurez la concentration superficielle de particules selon la norme IEST-STD-CC1246D.



Des solutions adaptées à vos besoins

Caractériser la propreté

Avec Clemex PSFilter vous acquérez une représentation complète de l'échantillon en générant des données statistiquement significatives, par analyse d'image. Contrairement au comptage des particules à l'aide d'un laser (LPC), le tout est parfaitement reproductible.

Conformité aux normes

Clemex PSFilter vous permet de choisir parmi plusieurs normes internationales pré-programmées, telles que IEST STD 1246D CC, ISO 16232, ISO 4406, ISO 4407 ou USP 788. Il vous offre également la possibilité de personnaliser les propriétés afin que vos spécifications internes soient appliquées.

Vue d'ensemble de l'échantillon

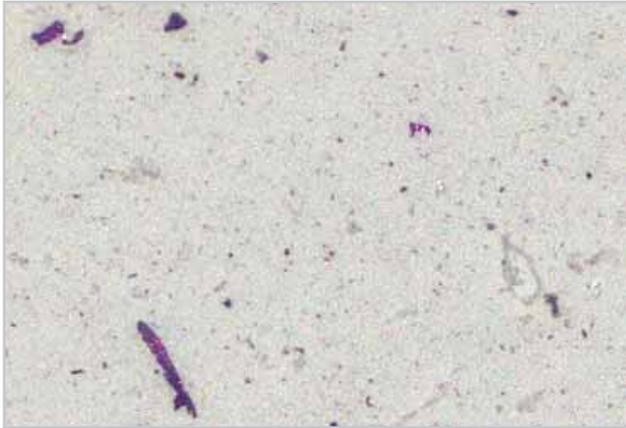
Différents types de supports peuvent être utilisés avec Clemex PSFilter: des filtres à membrane poreuse, des wafers, des rubans adhésifs ou des Gel-Paks. Clemex PSFilter permet au microscope de numériser et cartographier l'ensemble de l'échantillon en quelques minutes.

Besoin de détails ou de rapidité

Un microscope piloté par Clemex PSFilter analyse rapidement des particules de 5 microns et plus. Pour plus de détails, un microscope contrôlé par Clemex PSfilter permettra de quantifier les particules de 0,5 et plus.

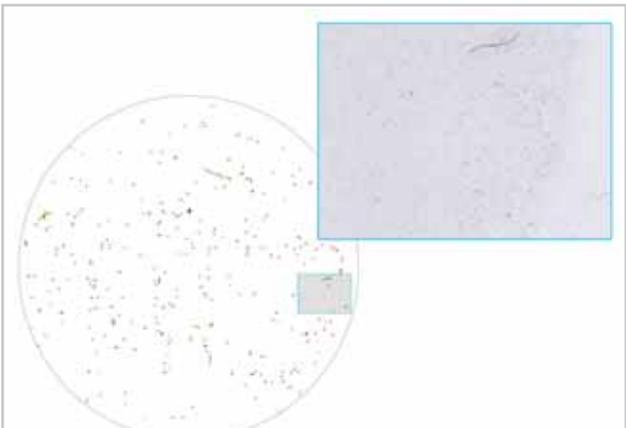
La solution d'avant-garde en pollution particulaire

Mesurer la contamination particulaire est d'une importance capitale dans les industries manufacturières et pharmaceutiques. Les dommages causés par ces particules peuvent souvent avoir des effets néfastes pour la machinerie et nocifs dans les produits pharmaceutiques. Clemex PSFilter est spécialement conçu pour analyser la contamination dans différents domaines, en mesurant les particules accumulées sur des filtres à membrane poreuse, des plaquettes de silicium (wafers), des rubans adhésifs ou des Gel-Paks.



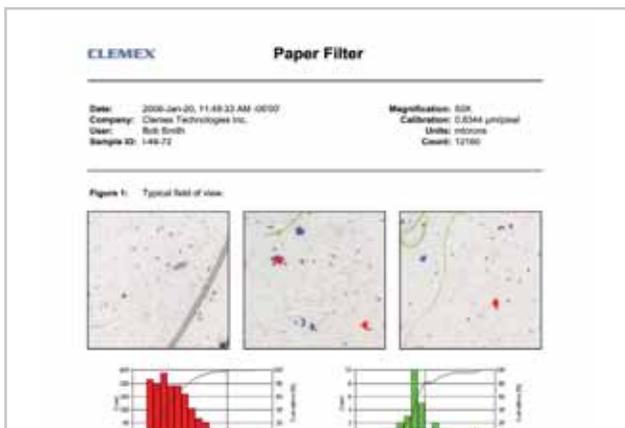
Une seule feuille de données pour les petites et grandes particules

Certains échantillons contiennent des particules de tailles variées. Clemex PSFilter balaye ces types d'échantillons deux fois, d'abord à fort grossissement, puis à faible grossissement, et combine les résultats des deux analyses sur une seule feuille de données.



Tous les types de particules détectées durant une analyse

Clemex PSFilter numérise automatiquement l'échantillon et détecte toutes les particules d'intérêt en une seule analyse. Comme chaque champ est analysé, les particules sont mesurées et triées en fonction de leur taille, leur morphologie ou leur couleur. Les feuilles de données sont mises à jour instantanément.



Des résultats rapides et reproductibles

L'instrument traite un grand nombre d'images, classe les particules, et génère un rapport facilement reproductible en quelques minutes. Ces résultats peuvent ensuite être utilisés à des fins de documentation et de présentation.

L'analyse des particules en 3 étapes faciles

Placez l'échantillon sur la platine, choisissez une méthode, cliquez sur Démarrer, et en quelques secondes les résultats sont tabulés. Tout est reproductible et traçable. Vous devez modifier une analyse? Clemex PSFilter est livré avec une liste impressionnante de paramètres modifiables, vous permettant de personnaliser vos analyses.



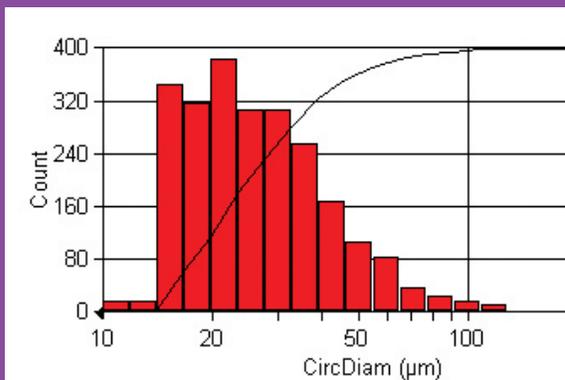
Étape 1

Sélectionnez une norme



Étape 2

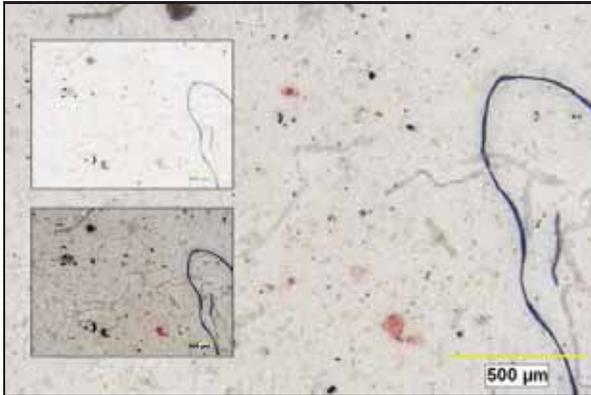
Numérisez l'échantillon



Étape 3

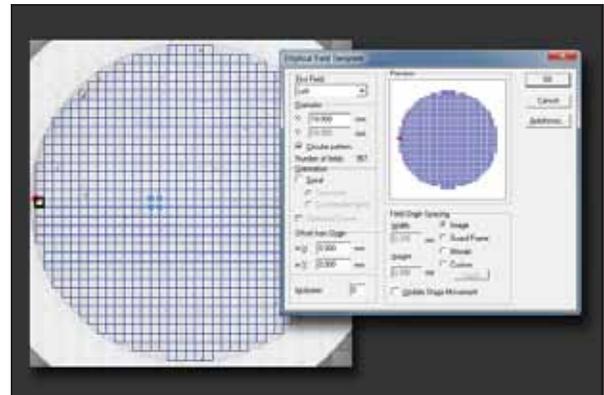
Exportez les résultats

Caractéristiques du produit



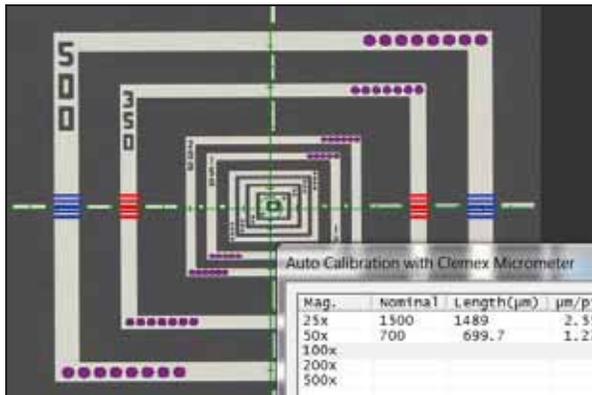
Exposition automatisée

Une fois l'intensité initiale réglée, vous pouvez reproduire ces mêmes conditions d'éclairage à tout moment en cliquant sur le bouton "Auto Exposure". Il n'est pas nécessaire de régler la vitesse d'obturation manuellement.



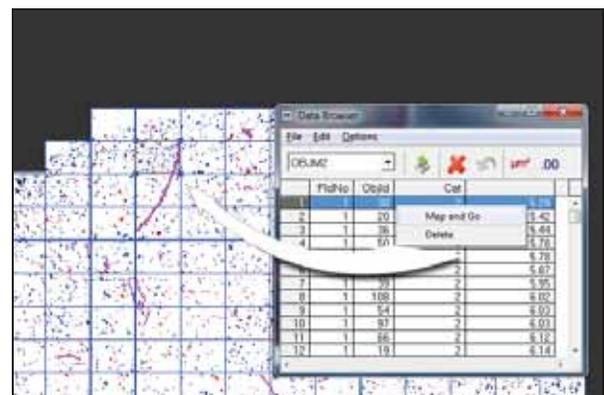
Quadrillages circulaires

Cette fonction vous permet de créer des modèles de quadrillages circulaires lors de l'analyse de filtres à membranes ou de plaques témoins. Vous contrôlez les variables telles que la taille, la forme, le nombre de champs, et le logiciel s'occupe du reste.



Étalonnage automatisé NIST

Grâce à notre micromètre traçable NIST, Clemex Vision PE calibre automatiquement chaque lentille, éliminant ainsi la subjectivité de l'utilisateur. Le système vous donne ainsi des résultats précis, reproductibles et traçables.



Suivi d'objets

Le tableau du Clemex PSFilter garde en mémoire la position de tous les objets analysés, même dans des environnements à champs multiples. Vous pouvez ainsi trier les résultats, valider les objets décelés et supprimer les artéfacts.

Caractéristiques du produit



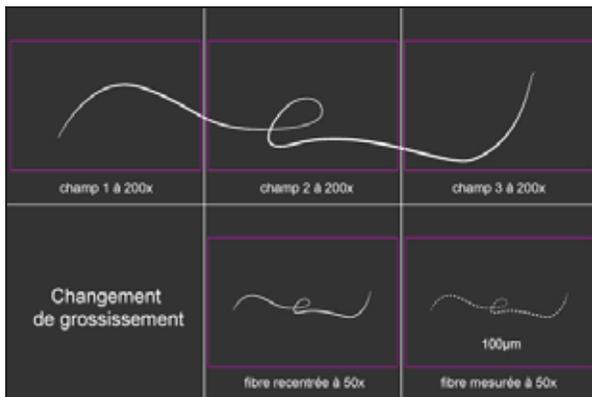
+ Aussi petit que 0,5 micron

Microscope Clemex PSFilter. Si vous avez besoin de détail pour des mesures précises, cet instrument de microscopie pouvant mesurer des particules aussi petites que 0,5 micron est pour vous.



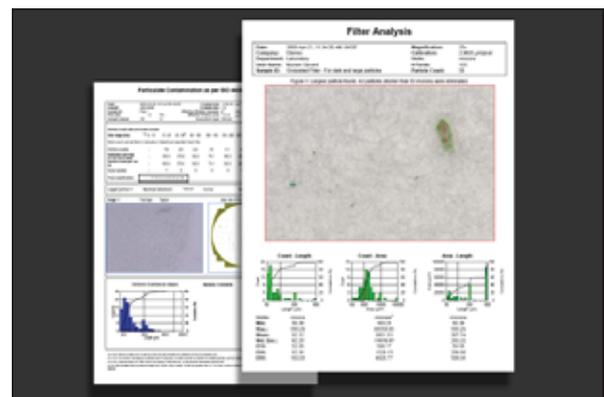
+ Plateau de maintien à vide

Tenez votre échantillon parfaitement plat avec le plateau de maintien à vide de Clemex. Ce plateau se branche sur votre ligne de vide existante ou procurez vous la pompe à vide ultra silencieuse de Clemex. Disponible pour un ou jusqu'à six échantillons à la fois.



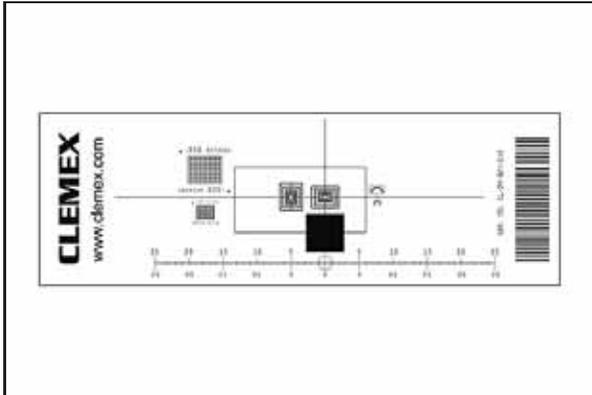
Objets longs - outils conditionnels

Après un balayage de l'échantillon, les objets plus longs que le champ de vision, tels que les fibres, sont mesurés en abaissant le grossissement et en recentrant les objets de sorte qu'elles puissent être affichées dans leur intégralité et mesurées avec plus de précision.



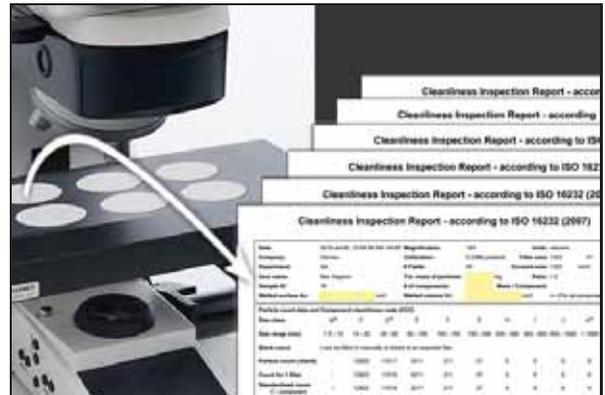
Rapports professionnels

Les rapports sont générés automatiquement après chaque analyse et peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques. Ajoutez le logo de votre entreprise, des images prises au cours de l'analyse, des graphiques, tableaux, statistiques et résultats.



+ Micromètre Clemex

Conçu pour l'étalonnage et la correction d'ombrage, le micromètre Clemex est livré avec un certificat de traçabilité NIST. Ce micromètre peut être utilisé aussi bien avec la lumière transmise qu'avec la lumière réfléchie. Facultatif.



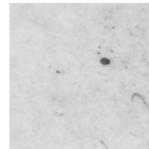
Gestion d'échantillons multiples

Vous pouvez analyser plus d'un échantillon durant un passage dépendant de votre platine et de votre porte-échantillon. Notre logiciel peut gérer jusqu'à six membranes-filtres. Suite à l'analyse, les données brutes peuvent être validées individuellement et des rapports sont générés pour chacun des filtres.

Rapports Connexes



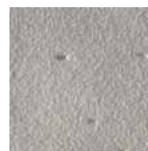
Evaluation du niveau de propreté



Test de propreté



Contamination particulaire



Comptage particulaire

Notre engagement: l'excellence en imagerie

Nous sommes les experts en applications d'analyses d'images microscopiques simples et complexes pour:

Les matières premières

Les poudres

Les pièces métalliques

Les contaminants

Les applications personnalisées

CLEMEX

www.clemex.com

Contact:

Clemex Technologies inc.
800 Guimond, Longueuil, QC, J4G 1T5, Canada
Telephone: 1.888.651.6573
info@clemex.com - www.clemex.com
© Copyright Clemex Technologies Inc. 06-2015